

**RANCANG BANGUN SISTEM KARAKTERISASI
KURVA I-V BERBASIS OP-AMP UNTUK
PENGUKURAN BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR
(BJT)**

*(DESIGN AND REALIZATION OF OP-AMP BASED I-V CURVE
CHARACTERIZATION SYSTEM FOR BIPOLAR JUNCTION
TRANSISTOR (BJT) MEASUREMENT)*

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan

Program Studi Strata-I Teknik Fisika

Disusun oleh:

MUHAMMAD FAKHRI MAULUDIN

1104154116



**Universitas
Telkom**

FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2019